文章编号: 1007-4627(2013) 04-0451-09

抗辐照纳米多层膜研究进展

张红秀,洪梦庆,肖湘衡,任峰,蒋昌忠

(武汉大学物理科学与技术学院,湖北武汉 430072)

摘要:大量研究表明,晶界和界面可以作为吸收缺陷(如空位、间隙原子)的"陷阱",因此含有大量晶 界、界面的纳米晶、金属和氮化物纳米多层膜,具备良好的自愈合抗辐照能力,从而成为近年来的研 究热点。综述了抗辐照纳米多层膜的研究进展,内容包括:材料的设计与制备,各种辐照模拟手段(如 中子辐照、离子辐照和多束离子辐照)。重点介绍了离子束辐照模拟反应堆辐照,多层膜在离子束辐照 下的行为(如微观结构和机械性能的演变)及纳米多层膜抗辐照机理。通过对CrN/AITiN 多层膜的离子 辐照,验证了纳米多层膜中界面对缺陷的吸收作用。对纳米多层膜未来研究方向做了展望。

关键词:纳米多层膜;辐照;力学性能

中图分类号: 0484.1; 0434.11; 0482.1 文献标志码: A DOI: 10.11804/NuclPhysRev.30.04.451

1 引言

自1942年第一座核反应堆建成以来,核能在世界 经济和军事领域中的应用得到迅速的发展, 随之辐射 损伤对核材料性能的影响问题日益突出。日本福岛核 事故再次表明核安全是核工业发展的生命线,其中核 材料的安全和性能尤为重要。Fermi在1946年就指出 "核技术的成败取决于材料在反应堆中强辐射场下的 行为"。辐照使材料中原子离位形成间隙原子、空位 和其他缺陷(位错、间隙环、空洞和堆垛层错四面体)。 这些缺陷不断聚集和演化,导致材料产生辐照肿胀 与蠕变、辐照硬化与脆化、辐照疲劳以及微结构的演 变、相变、偏析等现象[1],成为影响反应堆安全和寿 命的重要因素。因此,核材料是否具有良好的抗辐照 性非常重要。材料的抗辐照稳定性的关键在于材料的 微结构本身是否具有有效地同时消除空位和间隙原子 等缺陷的自愈合能力。基于中子经济性、良好的物理 性能和力学性能、抗辐照性能等要求,核工业材料主 要有如下几种: 铝及铝合金、镁合金、锆合金和不锈 钢等^[2]。然而,先进核能系统对材料的抗辐照能力提 出了更高的要求,以上材料目前都还难以符合这些要

求,必须改进或设计出抗辐照性能更高的新型材料。

大量的实验结果表明,纳米结构材料具有优异的抗辐照性能^[3-4]。纳米化是提高材料抗辐照性的有效手段之一。大角度晶界可以促进间隙原子和空位的复合,从而减小缺陷的聚集。Singh^[5]的研究表明,离子束辐照导致的空洞在靠近晶界处的生长速度大大减小。当纳米晶的粒径在一定的范围时是稳定的。Shen等^[6]和Zhang等^[7]发现粒径为4~12 nm的氧化物纳米晶MgGa₂O₄和粒径小于20 nm的Gd₂(Ti_{0.65}Zr_{0.35})₂O₇比相应的大晶粒传统材料的抗辐照性能高得多。同时也应该注意到,当纳米晶粒径小于或大于某个范围时,辐照会导致相变,从而降低材料抗辐照性能^[8]。当满足热力学关系

$$\Delta G_{
m gb} + \Delta G_{
m pd} > \Delta G_{
m pt}^{[8]}$$

时,相变可能发生。其中: ΔG_{gb} 是晶界自由能; ΔG_{pd} 是辐照导致的点缺陷自由能; ΔG_{pt} 是发生相变的自由能垒。当纳米晶粒径很小时,大量晶界使 ΔG_{gb} 的值很高,加上辐照诱发形成的缺陷的自由能,很容易满足上述热力学关系发生相变。如Meldrum等^[9–10]发现粒径为 3~6 nm 的 ZrO₂ 纳米晶,比相应

收稿日期: 2012-11-15; 修改日期: 2013-04-23

通信作者: 任峰,E-mail: fren@whu.edu.cn

基金项目: 国家自然科学基金资助项目(11175133, U1260102, 91026014)

作者简介:张红秀(1987-),女,河北邯郸人,硕士研究生,从事纳米材料的制备和抗辐照性能研究。

体材料更容易发生相变。对于大晶粒纳米晶,辐照后 形成大量缺陷不能被吸收或湮灭,导致缺陷自由能 增加,同样产生相变。Rose等^[11]发现辐照60~80 nm 的ZrO₂纳米晶,损伤剂量(dpa)为4时发生单斜-四方 相变。

多层膜的界面也可以提高材料的抗辐照性能。与 晶界相似,界面也是容易发生扩散的区域,因此界面 可以促进空位和间隙原子的扩散,从而提高它们的复 合率^[12]。最近,美国 Los Alamos 国家实验室 Michael Nastasi 研究团队、TexasA&M 大学张星航教授课题组 及合作者们研究发现,具备大量界面的金属纳米多层 膜比相应的块材的抗辐照性能可提高1个数量级,并 且这类多层膜的硬度随单层层厚的减少呈指数上升。 本课题组的研究也表明,小周期的氮化物纳米多层膜 比大周期金属纳米多层膜具有更好的抗辐照性。中国 科学院近代物理研究所的王志光课题组、北京大学重 离子物理研究所的王宇刚课题组也是国际上较早开展 纳米材料抗辐照研究的课题组。本文在广泛调研文献 并结合课题组研究结果的基础上,对当前抗辐照纳米 多层膜研究进展进行了综述。

2 纳米多层膜的设计与制备

多层膜是指按一定的原子(或厚度)比将两种材料(单质或合金)沿垂直于衬底方向周期性地交替沉积 在衬底上的薄膜材料。由于金属多层膜组成材料和结构上的特点,导致多层膜呈现超高硬度、巨磁阻和垂 直磁各向异性等奇特的机械和电磁性能。

纳米多层膜的制备方法主要有磁控溅射^[13-15]、 真空蒸镀、分子束外延以及电化学沉积^[16]等。我们采 用磁控溅射和离子镀法分别制备出不同周期的V/Ag 金属纳米多层膜和CrN/AlTiN氮化物纳米多层膜,并 对后者进行了离子辐照研究。

在多层膜成分的选择上主要考虑以下因素:

(1) 电子能损敏感性^[17]

材料对电子能损的敏感度可以通过一个比值 η 来 估计:

$$\eta = rac{Q}{\Delta H_{
m f}}$$
 ,

其中: $Q = 0.63S_e/\pi\lambda^2$,是在半径为 λ 的柱状区域内 的平均能量沉积密度, λ 是电子平均自由程; ΔH_f 是 金属熔化所需的能量。当 $\eta > 1.3$ 时,金属材料对电 子能损敏感;当 $\eta < 0.7$ 时,金属材料一定对电子能 损不敏感; $0.7 \le \eta \le 1.3$ 时,不能确定。研究表明, 材料熔点越低,熔化所需要的能量越小,对电子能损 越敏感,越容易造成两相混合。

(2) 两种材料的相互固溶度

组成多层膜的材料必须具有很小的固溶度,这样 的多层膜在高温下辐照过程中不至于发生严重的相互 扩散并合金化,从而保证界面清晰和完整。可以通过 系统的混合焓来寻找热扩散不明显或不易混合的系 统。Li等^[18]用100 keV He⁺ 辐照Fe 1 nm/W 1 nm 多层 膜,剂量为6×10¹⁶ ions/cm²,由于Fe 和W的互溶性, 辐照后的多层膜界面消失。Gao等^[19]用剂量为6×10¹⁷ ions/cm² He⁺ 辐照Cu 2.5 nm/W 2.5 nm 多层膜,由 于Cu和W不互溶,即使在最大损伤区,Cu和W的 界面依然存在(见图1)。(Al 25 nm/Ti 25 nm)₂₀多层膜 在能量为200 keV,剂量为4×10¹⁶ ions/cm²的Ar⁺离 子辐照后,由于辐照在Ti 层内产生的沿离子径迹温度 约1300 ℃的热峰,虽然热峰持续时间为1 ps,但Al-



图 1 He+ 辐照后截面 TEM 图片

(a) 100 keV, 6×10¹⁶ ions/cm² He⁺ 辐照 Fe 1 nm/W 1 nm 多层膜,界面消失^[18]; (b) 50 keV, 6×10¹⁷ ions/cm² He⁺ 辐照 Cu 2.5 nm/W 2.5 nm 多层膜,界面存在^[19]。

http://www.npr.ac.cn

Ti 受到热激发后反应放热,会迅速形成合金^[20]。 Li等^[21]用剂量为6×10¹⁶ ions/cm² (100 keV)He 离 子辐照Al/Nb多层膜(单层厚度1~200 nm),由于Al 和Nb互溶(混合热为-18 J/mol),在Al 2.5 nm/Nb 2.5 nm多层膜界面处形成Nb₃Al 合金。

(3) 核应用条件

核材料同时要考虑中子经济性(元素吸收中子截 面要小)、杂质含量满足核级纯、低活性、感生放射性 小和半衰期短等条件。

(4) 工业支持性

工业上能大规模生产, 耐高温、耐高压和耐腐蚀 等。

此外,要想得到高质量的多层膜,必须选择合 适的薄膜制备工艺参数。对于磁控溅射法, 需考虑 薄膜沉积时的温度和速率等。Budiman等^[22]通过大 量实验得出,要想得到单晶薄膜,需要提高沉积温 度和降低沉积速率(低温时,易生成多晶;高沉积 速率沉积,原子没有充分时间排列,易生成多晶); 而要想得到热稳定性高的多层膜,需要降低沉积 温度和提高沉积速率(高温时,原子扩散加快;低 沉积速率,扩散时间增加,最终都导致界面混合)。 多层膜制备时要综合考虑以上因素,选择最佳实 验条件。目前用于抗辐照性能研究的多为金属纳 米多层膜,如面心立方/体心立方结构的Ag/V^[23-26], Cu/W^[27], Cu/Nb^[28-30]和Fe/Nb^[31]等; 面心立方/面心 立方结构的Fe/Ni^[32-33], Ag/Ni^[16, 34-35]和Al/Ni^[36-37] 等。此外,还有面心立方/密排六方结构的Ti/Ni^[38], Fe/Ti^[39-40]和 Mg/Ni^[41]等。

本课题组用磁控溅射方法制备了周期为4,8, 12和16 nm的V/Ag 纳米多层膜,用透射电子显微镜、 选区电子衍射和X射线衍射探究了多层膜的微结构, 以及多层膜的取向关系随周期的变化。通过实验发 现,多层膜的生长分为两个阶段。在生长初期,受热 动力学和V原子的柱状生长模式影响,随着沉积的 进行,多层膜界面逐渐弯曲。生长过程的第二阶段, 由于薄膜沉积在弯曲界面上,"阴影效应"和"有限 原子体积效应"加剧了多层膜的弯曲。最终导致多 层膜柱状结构的形成。通过多层膜的高分辨电子显 微镜图像(HRTEM),我们发现多层膜呈现K-S取向关 系:(11)fcc//(110)bcc和<110>fcc//<111>bcc。同时, 随着周期减小,多层膜表现出择优取向。我们用纳米 压痕仪对多层膜进行了硬度测试,发现界面越平整 时,多层膜的硬度值越大。

3 离子束模拟辐照

材料辐照的中心问题是材料辐照行为和性能降级 问题。目前已积累了大量辐照数据,建立了反应堆材 料手册,新出现的材料问题可以借鉴已有数据进行分 析和推断,但是对于聚变堆的材料问题,由于没有强 流的14 MeV中子源,只能采用一系列的辐照模拟实 验和相应的理论分析推断其在聚变堆工况下的辐照行 为。所以发展了一系列的辐照模拟技术:

(1) 中子模拟辐照

美国劳伦斯利弗莫尔国家实验室(Lawrence Livermore National Laboratory, 简称LLNL)用加速器产 生氘束撞击转动的氚靶产生氘氚反应的聚变中子 源(RTNS-II中子源),取得一些表现聚变中子辐照 特征的结果,但这种装置通量低,辐照空间小,不 能给出工程可应用的数据。美国汉福德工程开发实 验室 (Hanford Engineering Development Laboratory, 简 称HEDL)的高通量快中子实验堆(FFTF)和美国国家 阿贡实验室(Argonne National Laboratory,简称ANL) 的快中子增殖工程实验堆EBR-II 是研究快中子 堆材料辐照效应的有力工具,一年内损伤剂量可 达50~100 dpa,样品温度易控,损伤均匀,可测试 宏观力学性能,有利于分析材料的综合性能。但中子 能量较低,平均能量为1 MeV,没有足够的嬗变产物, 不能反映14 MeV 中子的辐照行为。美国橡树岭国 家实验室 (Oak Ridge National Laboratory, 简称 ORNL) 的高通量同位素反应堆(HFIR)是裂变中子辐照模式; 85 MW的HFIR 具有进行各种辐照实验的能力,履 行4项任务:同位素生产、材料辐照、中子活化和中 子散射。

(2) 离子模拟辐照^[1]

利用中子辐照装置进行核材料的抗辐照研究有较 大的局限性。包括强中子源难以获得、费用昂贵、辐 照后样品有放射性需放置一段时间、研究周期长。美 国曼哈顿计划动员各地开展离子辐照实验,取得相当 大的成功。与中子辐照相比,离子辐照有独特优势, 与中子速度相同的离子轰击,可比中子轰击产生的原 子位移率高几个数量级^[42]。离子辐照可控性强、被辐 照材料很少产生诱发放射性、实验耗费较少,是一种

重要的新核材料筛选手段。离子辐照有重离子辐照和 轻离子辐照,二者各具特色,互相补充。重离子束辐 照损伤效率很高,样品没有放射性,易于观察测量。 轻离子质量较小,其中质子的质量与中子的相同,其 辐照损伤行为在一定程度上更接近中子的辐照肿胀行 为。嬗变气体氢和氦的存在,严重影响空洞的形核和 长大过程。因此,利用轻离子辐照,引入氦、氢气体, 可模拟这一过程,研究嬗变气体在辐照过程中的作 用。近年来,美国和日本开展多离子束共辐照实验, 用重离子产生移位损伤,轻离子注入相应浓度氢/氦元 素,模拟研究核材料在中子辐照和氡/氦协同作用下的 结构演变。日本将两台离子加速器引入到HVEM1300 高压电镜内,这台装置可以进行电子束与He 或H束 双束辐照,还可进行电子束、He束和重离子束3束辐 照。最近欧洲建设了以一台单极静电加速器和两台串 列静电加速器组成的三束粒子辐照系统 JANNUS。武 汉大学物理科学与技术学院在国内率先建立了加速 器-注入机-电镜联机装置。北京大学、中国原子能科

学研究院和厦门大学等单位也在积极筹建多束离子辐 照装置。

4 纳米多层膜辐照演变

离子束(如He)辐照会引入大量点缺陷,包括空 位、间隙原子和缺陷团(He 气泡、空洞和位错环等), 这些缺陷相互作用引发材料的肿胀、表面起泡和辐照 脆化等现象,从而破坏材料的机械完整性和微观结 构。目前,国内外一些研究小组用载能离子束模拟研 究反应堆结构材料中粒子辐照效应,评价在不同辐照 环境下候选材料的行为,确认其极限特性。

4.1 微观结构演变

本课题组用Ar⁺离子对制备的周期为3,5和7 nm的CrN/AlTiN 多层膜进行辐照^[43],辐照剂量为 1×10¹⁶ ions/cm² (图2(a)~(c)),3×10¹⁶ ions/cm² (图2(d) ~(e))。辐照剂量为1×10¹⁶ ions/cm²时,多层膜层状结 构依然保持完好。当辐照剂量提高到3×10¹⁶ ions/cm²



图 2 周期为 3, 5 和 7 nm 的 CrN/AITiN 多层膜辐照后的 TEM 图片

时,周期为5和7nm的多层膜界面部分消失,而周期 为3nm的多层膜界面清晰可见。另外,在周期为5 和7nm的多层膜中出现直径为(1.0±0.3)和(1.1±0.2) nm的Ar气泡,在周期为3nm的多层膜中未发现气 泡。这表明,辐照使周期为5和7nm的多层膜局部非 晶化并出现气泡,界面通过对辐照造成的缺陷的吸引 和释放,促进了缺陷的复合和湮灭,有效减少了辐照 对多层膜造成的损伤,提高了材料的抗辐照性能。

Fu等^[44-45]用直流磁控溅射制备单层厚度 1~200

http://www.npr.ac.cn

nm 的 Cu/V 多层膜,并用 50 keV 的 He 离子束辐照。 图 3 给出了单层厚度 2.5 nm 和 50 nm 的多层膜辐照后 的截面 TEM 像,同样剂量和能量下 He 离子束辐照, 后者 He 气泡的最大浓度是前者的 3 倍。Zhang 等^[46] 用150 keV, 1×10¹⁷ ions/cm² He 离子束辐照 Cu 2.5 nm /Nb 2.5 nm 多层膜和 Cu 体材料,在 Cu 体材料内观察 到大量气泡以及严重的缺陷的聚集,而在单层厚度 为 2.5 nm 的 Cu/Nb 多层膜中没有气泡,且层状结构保 持完好。Wei 等^[23, 26]用直流磁控溅射制备了单层厚度 为1~50 nm的V/Ag多层膜,用33 keV的He离子束辐 照,发现单层厚度为2 nm的V/Ag多层膜中He气泡 被观察到的浓度阈值为4%,单层厚度为6 nm的V/Ag 多层膜中He气泡被观察到的浓度阈值为2.5%,在50 nmV/Ag多层膜、Ag和V体材料中,即使很小的He 离子辐照量,都会观察到气泡,这说明He在多层 膜中的溶解度比体材料中的大,并且随多层膜厚 度减小而增大,即多层膜的抗辐照性增加。王志 光等^[31]用2 MeV 的Xe 离子辐照Si/[Fe(10 nm)/Nb(4 nm)/Fe(4 nm)/Nb(4 nm)]2/[Fe(4 nm)/Nb(4 nm)]4 多层膜, 当Xe离子剂量为 1×10^{14} ions/cm²时,Fe和Nb出现混 合并导致Fe基FeNb固溶体和Nb基FeNb固溶体形 成。Gao等^[19]用50 keV 的He⁺辐照Cu/W多层膜,辐 照剂量为 $7\times10^{16}\sim6\times10^{17}$ ions/cm²,在dpa为70时, 单层厚度为2.5 nm的Cu/W多层膜层状结构依然稳 定。



图 3 (在线彩图) Cu/V 多层膜辐照前后 TEM 截面像 (a) 未辐照样品 Cu 50 nm/V 50 nm, (b) Cu 2.5 nm/V 2.5 nm, (c) 辐照后样品 Cu 50 nm/V 50 nm, (d) Cu 2.5 nm /V 2.5 nm^[45]。

4.2 机械性能演变

高能离子辐照金属产生大量缺陷,包括空位、间 隙原子、气泡和位错环,通常会降低材料的机械性能, 最显著的就是屈服强度的增加和脆化^[18]。He 气泡和 位错环是辐照导致的两种主要缺陷。不同类型缺陷对 滑动位错的阻碍作用不同,从而对辐照硬化的贡献的 不同。空洞和大尺度析出相对滑动位错的阻碍作用 大;小气泡、位错网和小尺度缺陷团簇对滑动位错的 阻碍较小。Li等^[18]用100 keV,1×10¹⁶ ions/cm² 的He 离子辐照 Fe/W和Cu/V多层膜,图4给出了辐照前和 辐照后 Fe/W多层膜硬度随层厚的变化关系(Cu/V 辐 照后硬度变化趋势与Fe/W多层膜相似)。对于未辐照 多层膜,硬度随周期厚度的减小而增加。当单层厚度 大于 50 nm 时,硬度与层厚的关系遵循规律 Hall-Petch 规律^[47-48]即位错在界面处堆积,硬度与层厚的关系为 $H \propto h^{-1/2}$;随着厚度的减小,位错越来越难以在界面处堆积,当层厚在10~50 nm时,偏离Hall-Petch规律,单个滑动位错被限制在单层内发生弯曲,遵循CLS规律(confined layer slip)^[49-50];当层厚为几纳米时,位错穿过界面为主要机制^[25,51]。从图中还可看出,多层膜的强度比相应体材料的要高,且辐照硬化现象随单层厚度的减小而减小,当层厚为1 nm时,辐照没有导致多层膜的硬化。Li用剂量为6×10¹⁶ ions/ cm² (100 keV)He离子辐照Al/Nb多层膜(单层厚度1~200 nm),却发现辐照硬化随层厚减小而增加。这是因为辐照小周期Al/Nb多层膜,导致在界面处形成稳定的高硬度AlNb合金相,使硬度比辐照前样品大大增加。

http://www.npr.ac.cn



图 4 (在线彩图)(a) 辐照前后单层厚度不同的多层膜的硬度,虚线分别对应辐照前后体材料的硬度; (b) 辐照后单层厚 度不同的多层膜的硬度变化,可见硬化现象随层厚的减小而减弱,当层厚小于2.5 nm 时,辐照硬化很微弱几乎没 有^[18]

5 纳米多层膜抗辐照机理研究

5.1 界面对缺陷的吸收过程

纳米材料表现出超常的抗辐照性能,探索多层膜 抗辐照的机制,有助于更好地寻找具有抗辐照性能的 核材料。Bai等^[52]用分子动力学(MD)方法模拟辐照 过程,解释了纳米材料的抗辐照机制。首先用 MD 方 法模拟级联碰撞阶段。如图 5 所示,由一个载能粒子 撞击晶界,在 0.5 ps 时级联碰撞达到最大;10 ps 后, 碰撞减弱。大部分离位原子回到晶格位上,其他原子 成为离位原子,导致间隙原子和空位的产生。





(a) 最初,一个PKA撞击界面;(b)碰撞级联达到最大;(c)碰撞冷却,多数离位原子重新回到晶格位置,剩下5个空位团在界面上下^[52]。

Misra 等^[53]研究了点缺陷(以空位为代表)的形成 能,表明界面处形成能最低,如图6所示,所以缺陷 产生后较多向界面处运动,而间隙原子比空位运动得 快,所以导致图5(c)中最终剩下5个空位团。

为了研究这些剩下的空位团如何演化,Bai等^[52]用 TAD (Temperature Accelerated Dynamics,简称 TAD) 方法遵循缺陷动力学模拟空位行为。图7给出了空位 与界面作用以及空位被界面吸收的整个过程。由于间 隙原子先到达界面,形成含有间隙原子的界面。吸收





间隙原子的界面使空位在界面附近的形成能大为降 低,即界面吸引空位的能力增强,而附近含有空位的 界面释放间隙原子能力也增强,这样界面可以作为 "源"来释放间隙原子与空位复合和吸引空位到界面 内与间隙原子复合两种方式降低系统能量,最终达到 自愈合。





黑色小球代表正常晶格原子(只在(a)图显示),绿色为间隙原子,红色是空位,蓝色小球是移动超过1Å的原子,箭头表示移动方向,(a)MD方法模拟的最初损伤结果,虚线内是界面;(b)21.3 ns后,界面下的5个空位聚集成空位团;(c)和(d)23.0 ns时,界面释放3个间隙原子与空位复合;(e),(f)和(g)界面释放两个间隙原子与空位复合;(h)和(i)两个空位跳到界面处与间隙原子复合(h)和(i)^[52]。

5.2 辐照对结构影响

离子辐照体材料,由于 5.1 节提到间隙原子扩散 快,并且偏向界面迁移,所以大量间隙原子移向表 面,剩下空位无法被湮灭,导致材料晶格不稳定和 非晶化。离子辐照多层膜后,大量界面的存在缩短了 缺陷扩散的距离,可以有效地通过 5.1 节中"吸收-释 放"机制湮灭缺陷,防止缺陷发生团聚形成稳定团 簇。气泡是空位团吸收He离子后形成,当多层膜层厚 足够小时,可以抑制空洞团的形成,从而防止气泡形 成。如 4.1 节中的 Cu/V、CrN/AlTiN 多层膜,在小周 期层厚时没有观察到气泡。

5.3 辐照硬化

界面对缺陷吸收的另一个结果是降低了材料的辐 象, http://www.npr.ac.cn

照硬化。硬化是由于辐照引入的缺陷以及缺陷聚集相 互作用后形成的气泡,堆垛层错四面体、间隙原子环 等成为位错运动的阻碍。对于不互溶多层膜,如Cu 2.5 nm/V 2.5 nm多层膜,辐照后界面依然存在,且大 量缺陷被界面吸收,没有发生辐照硬化;对于Fe/W 互溶多层膜,虽然硬化随层厚变化曲线与Cu/V 的相 似,层厚为1 nm 时没有发生辐照硬化,除了上述界 面对缺陷的吸收作用外,还由于辐照损坏Fe 和W的 界面,部分降低界面对位错的阻碍作用,减小了辐照 硬化。对于 Al/Nb 多层膜,在界面形成稳定的高硬度 的Nb₃Al 合金,使多层膜硬度比辐照前提高。

总之,理想的多层膜是通过界面对缺陷的大量吸 收,降低缺陷导致的相变、非晶化、硬化和脆化等现 象,从而提高多层膜抗辐照能力。

6 总结与展望

纳米多层膜由于具有大量界面,所以吸收缺陷的 能力显著提高,导致其抗辐照性能比相应块材料大大 增加,是未来先进核能系统核材料的候选材料。尽管 此类纳米材料的设计、制备和抗辐照研究日益增多, 研究队伍逐步扩大,一些新的研究成果也不断出现, 但从总的研究情况来看,还处于研究的初期阶段,仍 需要大量的深入研究。在实验上,一方面是优化和选 择不同元素组合,制备多层膜并研究其抗辐照性能, 另一方面是分析缺陷的形成、扩散和界面的演变过 程,特别是用电子显微学等先进手段从原子尺度加以 深入的分析。在理论上,对于实验很难测定的动力学 参数和粒子与固体相互作用的过程,将通过计算机模 拟方法进行分析,并将实验数据和理论计算结果进行 比较和综合分析后得到金属多层膜抗辐照机理。

参考文献(References):

 WANG Zhiguang. Nuclear Physics Review, 2006, 23(2): 156. (in Chinese)

(王志光. 原子核物理评论, 2006, 23(2): 156.)

- YU Jinnan. Irradiation Effect of Reactor Material[M]. Beijing, Chemical Industry Publisher, 2007, 5-6. (in Chinese)
 (郁金南. 材料辐照效应[M]. 北京: 化学工业出版社, 2007, 5-6.)
- [3] SICKAFUS K E, MINERVINI L, GRIMES R W, et al. Science, 2000, 289(5480): 748.
- [4] BRINGA E M, MONK J D, CARO A, *et al.* Nano Letters, 2012, 12(7): 3351.
- [5] SINGH B N. Philosophical Magazine, 1973, 28(6): 1409.
- [6] SHEN T D, FENG S H, TANG M, *et al.* Applied Physics Letters, 2007, **90**(26): 263115.
- [7] ZHANG J M, LIAN J, FUENTES A F, *et al.* Applied Physics Letters, 2009, 94(24): 243110.
- [8] SHEN T D. Nuclear Instruments and Methods B, 2008, 266(6): 921.
- [9] MELDRUM A, BOATNER L A, EWING R C. Physical Review Letters, 2002, 88(2): 025503.
- [10] MELDRUM A, BOATNER L A, EWING R C. Nuclear Instruments and Methods B, 2003, 207(1): 28.
- [11] ROSE M, GORZAWSKI G, MIEHE G, et al. Nano Structured Materials, 1995, 6(5): 731.
- [12] ZHANG X, FU E G, LI N, et al. Journal of Engineering Materials and Technology, 2012, 134(4): 1010.
- [13] MISRA A, HUNDLEY M F, HRISTOVA D, et al. Journal of Applied Physics, 1999, 85(1): 302.

- [14] MARA N A, MISRA A, HOAGLAND R G, et al. Materials Science and Engineering A, 2008, 493(1/2): 274.
- [15] CHOWDHURY P, KULKARNI P D, KRISHNAN M, et al. Journal of Applied Physics, 2012, 112(2): 3912.
- [16] WEN S P, ZONG R L, ZENG F, et al. Applied Surface Science, 2009, 255(8): 4558.
- [17] WANG Z G, DUFOUR C, PAUMIER E, et al. Journal of Physics: Condensed Matter, 1994, 6(34): 6733.
- [18] LI N, FU E G, WANG H, *et al.* Journal of Nuclear Materials, 2009, 389(2): 233.
- [19] GAO Y, YANG T F, XUE J M, *et al.* Journal of Nuclear Materials, 2011, **413**(1): 11.
- [20] MILOSAVLJEVIC M, STOJANOVIC N, PERUSKO D, et al. Applied Surface Science, 2012, 258(6): 2043.
- [21] LI N, MARTIN M S, ANDEROGLU O, *et al.* Journal of Applied Physics, 2009, **105**(12): 123522.
- [22] BUDIMAN A S, LI N, WEI Q, et al. Thin Solid Films, 2011, 519(13): 4137.
- [23] WEI Q M, WANG Y Q, NASTASI M, et al. Philosophical Magazine, 2011, 91(4): 553.
- [24] WEI Q M, LIU X Y, MISRA A. Applied Physics Letters, 2011, 98(11): 111907.
- [25] WEI Q M, LI N, MARA N, *et al.* Acta Materialia, 2011, **59**(16):6331.
- [26] WEI Q M, MISRA A. Acta Materialia, 2010, **58**(14): 4871.
- [27] WANG Y C, MISRA A, HOAGLAND R G, et al. Scripta Materialia, 2006, 54(9): 1593.
- [28] MARA N, SERGUEEVA A, MISRA A, *et al.* Scripta Materialia, 2004, **50**(6): 803.
- [29] AYDINER C C, BROWN D W, MARA N A, *et al.* Applied Physics Letters, 2009, **94**(03): 031906.
- [30] LI N, MARA N A, WANG Y Q, et al. Scripta Materialia, 2011, 64(11): 974.
- [31] WEI Kongfang, WANG Zhiguang, GOU Jie, *et al.* Journal of the Korean Physical Society, 2009, 55(6): 2697.
- [32] WEI Kongfang, WANG Zhiguang, SUN Jianrong, et al. Nuclear Physics Review, 2009, 26(4): 333.
- [33] AMARAL L, SCORZELLI R B, BRUCKMAN M E, et al. Journal of Applied Physics, 1997, 81(8): 4773.
- [34] CAI M, VERES T, MOREL R, *et al.* Journal of Applied Physics, 1996, **79**(8): 6289.
- [35] KANG B C, KIM H Y, KWON O Y, *et al.* Scripta Materialia, 2007, 57(8): 703.
- [36] SANDSTRÖM P, SVEDBERGA E B, JOHANSSON M P, et al. Thin Solid Films, 1999, 353: 166.
- [37] CAO J, SONG X G, WU L Z, et al. Thin Solid Films, 2012, 520(9): 3528.
- [38] KNEPPER R, SNYDER M R, FRITZ G, et al. Journal of Applied

http://www.npr.ac.cn

Physics, 2009, 105(8): 083504.

- [39] PADIYATH J, STAHN J, HORISBERGER M, et al. Applied Physics Letters, 2006, 89(11): 113123.
- [40] WUZL, PENGTX, CAOBS, et al. Thin Solid Films, 2009, 517: 6553.
- [41] LEI M K, WU Z L, CHEN T, et al. Thin Solid Films, 2006, 500: 174.
- [42] ZHANG H, WANG X L, QIAO Y Q, et al. Applied Surface Science, 2011, 257(13): 5759.
- [43] WANG Zhiguang. Nuclear Physics Review, 2006, 23(2): 216.(in Chinese)

(王志光. 原子核物理评论, 2006, 23(2): 216.)

- [44] HONG M Q, REN F, ZHANG H X, et al. Applied Physics Letters, 2012, **101**(15): 153117.
- [45] FU E G, MISRA A, WANG H, *et al.* Journal of Nuclear Materials, 2010, **407**(3): 178.
- [46] FU E G, CARTER J, SWADENER G, et al. Journal of Nuclear

Materials, 2009, 385(3): 629.

- [47] ZHANG X, LI N, ANDEROGLU O, *et al.* Nuclear Instruments and Methods B, 2007, 261(1/2): 1129.
- [48] FRIEDMAN L H, CHRZAN D C. Physical Review Letters, 1998, 81(13): 2715.
- [49] ANDERSON P M, LI C. NanoStructured Materials, 1995, 5(3): 349.
- [50] PHILLIPS M A, CLEMENS B M, NIX W D. Acta Materialia, 2003, 51(11): 3157.
- [51] MISRA A, HIRTHA J P, KUNG H. Philosophical Magazine A, 2002, 82(16): 2935.
- [52] MISRA A, HIRTH J P, HOAGLAND R G. Acta Materialia, 2005, 53(18): 4817.
- [53] BAI X M, VOTER A F, HOAGLAND R G, et al. Science, 2010, 327(5973): 1631.
- [54] MISRA A, DEMKOWICZ M J, ZHANG X, et al. Small Scale Mechanical Behavior, 2007, 59(9): 62.

Research Progress on Radiation Tolerance of Multilayer Nanofilms

ZHANG Hongxiu, HONG Mengqing, XIAO Xiangheng, REN Feng, JIANG Changzhong (School of Physics and Technology, Wuhan University, Wuhan 430072, China)

Abstract: Numerous studies show that interface can serve as effective sinks for radiation-induced defects such as interstitials and vacancies. Owning a large number of interfaces, multilayer nanofilms attract a great research interest. In this paper, we review recent research progress on the development of the multilayer nanofilms for the purpose of radiation tolerance. The paper includes following parts: how to design and prepare multilayer nanofilms materials; evaluation with radiation simulation, such as neutron irradiation, ion irradiation and multi-beam ion irradiation; behaviors of multilayer nanofilms under ion beam irradiation, such as microstructure evolution and changes in mechanical properties; theoretical study on the mechanism of radiation tolerance of multilayer nanofilms. Finally, the challenge and future research directions are briefly discussed.

Key words: multilayer nanofilm; radiation tolerance; mechanical properties

Foundation item: National Natural Science Foundation of China(11175133, U1260102, 91026014)

Corresponding author: REN Feng, E-mail: fren@whu.edu.cn

Received date: 15 Nov. 2012; Revised date: 23 Apr. 2013

http://www.npr.ac.cn